

## Caractérisation

---



### CARACTÉRISATION PHYSIQUE

- Microscope à force atomique - AFM (Atomic Force Microscopy) en mode tapping et modes électriques
- Diffractomètres à rayon X
- Appareil de mesure effet HALL
- Spectromètre FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy)
- Mercury probe
- Mesure 4 pointes - mesure de la résistivité
- Mesure de la tension superficielle par angle de goutte
- Granulomètre
- Profilomètre optique
- Vibromètre laser à effet Doppler

### CARACTÉRISATION ÉLECTRIQUE

- Station sous pointe - mesures I(V), C(V), impédance, tests destructifs CVS/LRVS (Linear Ramped Voltage Stress), RF
- Testeur ESD (ElectroStatic Discharge)
- Spectroscopie des niveaux profonds - DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy)
- Station sous pointe cryogénique



- Mesure 4 pointes
- Ellipsomètre spectroptique - SEMILAB
- Profilomètre mécanique - KLA Tencor

- Spectromètre de masse



- Banc d'impédance
- Vibromètre laser
- Banc de caractérisation optique et acoustique
- Nanoscratch testeur
- Equipement de nanoindentation